Влияние температуры на структурные превращения в нанокристаллических пленках кобальта

© Г.И. Фролов, В.С. Жигалов, В.К. Мальцев

Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, 660036 Красноярск, Россия

E-mail: frolov@iph.krasnoyarsk.su

(Поступила в Редакцию 28 апреля 1999 г. В окончательной редакции 12 июля 1999 г.)

> В нанокристаллических пленках кобальта с помощью ядерного магнитного резонанса и вибрационного магнитометра исследовано влияние температуры отжига на структуру и магнитные свойства. Интерпретация экспериментальных данных показывает, что в исходном состоянии пленки за счет высокой степени разупорядочения как в межкристаллитных областях, так и в наночастицах имеют аморфноподобную структуру, которая переходит в равновесное поликристаллическое состояние через формирование ряда промежуточных фаз.

В настоящее время большой интерес вызывают нанофазные материалы, являющиеся трехмерным аналогом мультислойных структур [1]. Они проявляют необычные физические свойства, что связано с возникновением в них новых твердотельных состояний [2]. Примером таких материалов являются нанокристаллические пленки 3*d*-металлов, получаемые методом импульсноплазменного напыления [3-6]. Особенностью используемого метода напыления являются: высокая импульсная скорость конденсации (~ 10⁵ A/s) при длительности импульса $\sim 10^{-4}$ s и скважности импульсов $\sim 10^3 - 10^4$, скорость охлаждения конденсата $\sim 10^8$ K/s [5]. При этих технологических условиях в вакууме 10⁻⁶ Тогг формируются пленки, представляющие собой набор нанокристаллитов 3*d*-металла (размером ≤ 4 nm), окруженных углеродной "шубой" [6].

Новизна метода заключается в том, что выбрано направление предельного диспергирования кристаллической структуры, реализуемое при сверхвысоких скоростях конденсации, когда число возникающих зародышей так велико, что радиус критического зародыша совпадает с радиусом коалесценции. С другой стороны, высокая поверхностная химическая активность образовавшихся нанокристаллитов в условиях метода плазменного напыления и большая скважность импульсов приводит к тому, что конденсат захватывает большое количество атомов примеси (в основном, углерод) из остаточных газов вакуумной камеры.

Исходя из совокупности данных по магнитным и электрическим свойствам, по структурным и спектральным измерениям в пленках железа, полученных в этих технологических условиях [3,6], было сделано предположение, что центральная часть структурных наноблоков есть фаза пересыщенного раствора углерода в α -Fe; для пленок кобальта этот вопрос остается открытым. Дело в том, что в пленках Со содержание углерода больше, чем в пленках Fe (30 и 20 at.% С соответственно), а по литературным данным известно, что увеличение содержания углерода в наногранулированных пленках кобальта приводит к изменению фазового состава центральной части структурного блока, а именно к переходу от ГПУ Со к соединению Со₃С [7,8]. Поэтому детализация исходной структуры нанокристаллических пленок Со необходима для интерпретации их необычных свойств.

В данной работе с помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и вибрационного магнитометра проведено исследование влияния температуры отжига на структуру и магнитные свойства пленок кобальта, полученных методом импульсно-плазменного напыления. Известно, что в магнитоупорядоченных материалах величина и распределение сверхтонкого поля на ядре пропорциональны намагниченности и несут информацию о локальном электронном и химическом окружении атома. Поэтому анализ спектров ЯМР позволяет детализировать структуру исследуемых образцов.

Толщина пленок, напыленных на стеклянные и кремниевые подложки, составляла 50–100 nm. Образцы подвергались многоступенчатому отжигу в вакууме 10^{-5} Torr в течение одного часа для каждой фиксированной температуры (T_{an}). Спектры ЯМР снимались методом спинового эха при комнатной температуре. Использовалась стандартная двухимпульсная методика.

На рис. 1, *а* приведен спектр ЯМР для пленки в исходном состоянии. Видно, что линия ЯМР представляет собой размытый пик с центром на частоте $f \sim 190$ MHz и шириной ~ 50 MHz. При нагревании образца до $T_{an} = 400-500$ К наблюдается сильное изменение спектра. Резонансный пик смещается в область более высоких частот, его максимум находится на f = 215 MHz. При $T_{an} \sim 400$ К спектр имеет длинный "хвост" на левом краю линии (рис. 1, *b*). Этот "хвост" содержит несколько пиков, причем положение и количество пиков изменяется от образца к образцу и зависит от содержания углерода.

При дальнейшем увеличении температуры отжига форма пика видоизменяется: вместо симметричного размытого пика (рис. 1, c) возникает узкий пик на f = 213 MHz и "платформа" в диапазоне частот 214–221 MHz (рис. 1, d). При $T_{an} = 700 \text{ K}$ пик ста-



Рис. 1. Спектры ядерного магнитного резонанса для пленки кобальта, полученных импульсно-плазменным напылением. *a* — исходное состояние, *b-e* — после отжигов при температурах *T*_{an} = 400, 500, 600 и 700 К соответственно.

новится еще более узким при сохранении резонансной частоты, амплитуда платформы уменьшается (рис. 1, *e*).

На рис. 2 представлена зависимость намагниченности (I_s) нанокристаллической пленки Со от температуры отжига. В исходном состоянии намагниченность составляет ~ 850 G, что значительно меньше намагниченности массивного кобальта. При отжиге до $T_{an} \leq 550$ K наблюдается дальнейшее уменьшение I_s , а при $T_{an} \geq 600$ K намагниченность возрастает практически до значения, характерного для массивного Со.

Проанализируем экспериментальные результаты, представленные на рис. 1 и 2. Изменение спектра ЯМР при отжиге наших пленок качественно повторяет аналогичную зависимость для аморфных сплавов Со-Р [9,10]. Авторы этих работ наблюдали уширение и смещение в область низких частот линии ЯМР для аморфных кобальтовых лент и пленок. Снижение частоты ЯМР и соответственно уменьшение сверхтонкого поля на ядрах Со связывается с переносом электронов от ионов фосфора к ионам кобальта. Наши образцы, как показывают рентгеноструктурные исследования, состоят из нанокристаллитов размером меньше 4 nm и, согласно данным оже-спектроскопии, содержат до 30 at.% С. Можно предположить, что весьма уширенная форма спектра ЯМР в исходных исследуемых пленках свидетельствует о высокой степени структурного разупорядочения, которая определяется не только межзеренными графитоподобными областями и высоким отношением поверхностных атомов Со к объемным, но и отсутствием порядка среди ионов углерода, растворенных в наночастицах кобальта. Последнее предположение подтверждается наличием сателлитов в спектре ЯМР после первичного отжига. Число сателлитов может соответствовать количеству ионов углерода, находящихся в ближайшем окружении каждого атома кобальта. Такой разброс атомных конфигураций обусловливает форму спектра исходных пленок, сходную со спектром для аморфных материалов Со–Р.

Подобное необычное сочетание аморфности и нанокристалличности описано в работе [11]. Авторы исследовали микроструктуру гранулированных пленок, полученных совместным распылением Со и С, в зависимости от концентрации углерода и температуры подложки. Они



Рис. 2. Зависимость намагниченности (I_s) нанокристаллической пленки Со от температуры отжига T_{an} .

обнаружили, что их образцы, содержащие 27 at.% С, состоят из наночастиц Со диаметром ~ 5 nm, разделенных углеродными прослойками. Однако авторам не удалось определить структуру наночастиц даже при использовании высокоразрешающей электронной микроскопии и они интерпретируют ее как аморфноподобную.

При нагревании пленок до $T_{an} = 400-500$ К, очевидно, происходит вытеснение углерода из наночастиц Со и резонансный пик смещается в область более высоких частот (рис. 1, *b*, *c*). На этих же частотах наблюдается сигнал ЯМР в поликристаллических пленках Со-Р [10] и при комнатной температуре он представляет собой суперпозицию двух резонансных линий, одна из которых связана с ГЦК фазой, а другая с ГПУ фазой Со ($f_1 = 213$ и $f_2 = 221$ MHz соответственно). Длинный хвост на левом краю линии ЯМР после первого отжига (рис. 1, *b*) может быть связан с тем, что вытеснение углерода из наночастиц Со из-за невысокой температуры не было полным.

Образование магнитных фаз ГПУ и ГЦК Со (рис. 1, *c*), казалось бы, должно привести к увеличению намагниченности в обрацах, а мы наблюдаем уменьшение I_s по сравнению с исходным значением почти в 1.5 раза (рис. 2). Для объяснения такого противоречия вновь обратимся к работе [11], где показано, что в гранулированных пленках Со, напыленных совместно с углеродом при температуре подложки T = 470 K, образуются наночастицы, содержащие смесь фаз Co₂C + ГПУ Со. Авторы считают, что T = 470 K является как раз температурой формирования карбидного соединения. Поскольку фаза Co₂C не проявляет магнитных свойств при комнатной температуре, то ее образование должно приводить к уменьшению интегральной намагниченности.

При $T_{an} > 600$ К форма кривой ЯМР видоизменяется в пределах того же частотного диапазона, на ней появляется узкий пик и широкий пологий участок, которые связаны с хорошо ориентированной ГЦК фазой и сильно разупорядоченной ГПУ фазой кобальта. Согласно данным работы [11], при T = 620 К фаза Co₂C разлагается на ГПУ Со и графитоподобный углерод. Это должно приводить к увеличению намагниченности образцов, что мы и наблюдаем на рис. 2.

Дальнейшее повышение температуры отжига приводит к увеличению вклада ГЦК фазы за счет уменьшения содержания ГПУ Со (рис. 1, e), при этом намагниченность практически не меняется.

Таким образом, использование метода ЯМР для исследования структуры нанокристаллических пленок кобальта показало, что в исходном состоянии наши образцы состоят из наночастиц Со с внедренными в них атомами углерода. Отжиг при $T_{an} > 550$ К приводит к формированию смеси ГПУ и ГЦК Со. При дальнейшем повышении температуры отжига наблюдается переход к состоянию с высоким содержанием ГЦК фазы. Необычное поведение температурной зависимости намагниченности связано с формированием немагнитной фазы карбида Со при $T_{an} = 400-500$ К и ее разложением при $T_{an} > 550$ К.

Список литературы

- [1] R.W. Siegel. Phys. today 10, 64 (1993).
- [2] J.P Perez, V. Dupuis, J. Tuaillon, A. Perez, V. Paillard, P. Melinon, M. Thomas, B. Barbara, B. Bouchet-Fabre. J. Magn. Magn. Mater. 145, 1–2, 74 (1995).
- [3] Г.И. Фролов, В.С. Жигалов, С.М. Жарков, И.Р. Яруллин. ФТТ 36, 4, 970 (1994).
- [4] Г.И. Фролов, В.С. Жигалов, А.И. Польский, В.Г. Поздняков. ФТТ 38, 4, 1208 (1996).
- [5] В.С. Жигалов, Г.И. Фролов, Л.И. Квеглис. ФТТ 40, 11, 2074 (1998).
- [6] S.G. Ovchinnikov, B.A. Belyaev, I.S. Edelman, G.I. Frolov. Micron/submicron technologies for magnetic structures. Препринт № 776Ф. Красноярск (1997).
- [7] Y.Saito, T. Yoshikawa, M. Okuda, N. Fujimoto, S. Yamamuro, K. Wakoh, K. Sumiyama, K. Suzuki, A. Kasuya, Y. Nishina, J. Appl. Phys. 75, *1*, 134 (1993).
- [8] Y. Yosida, S. Shida, T. Ohsuna, N. Shiraga. J. Appl. Phys. 76, 8, 4533 (1994).
- [9] K. Ray, J. Durand, J.I. Budnick, S. Skalski. J. Appl. Phys. 49, 3, 1671 (1978).
- [10] В.К. Мальцев, Г.И. Фиш, В.И. Цифринович. ФММ 52, 2, 439 (1981).
- [11] J.J. Delaunay, T. Hayashi, M. Tonita, S. Hirono. J. Appl. Phys. 82, 5, 2200 (1997).